

## 등록안내

### ■ 사전등록

- 2012년 11월 16일(금요일)
- 등록방법 : 등록 신청서를 한국진공학회 홈페이지(<http://www.kvs.or.kr>)에서 다운 받아 작성 후 Fax로 한국진공학회에 발송

구분	사전등록	현장등록
일 반	140,000원	150,000원
대학원생	90,000원	100,000원
학부생	50,000원	50,000원

- 문의처 : 한국진공학회 사무국  
Tel : 02-567-9486 / Fax : 02-556-5675  
E-mail : kvs@kvs.or.kr

### 한원석(한국전자통신연구원)

Tel : 042-860-1167  
E-mail : wshan@etri.re.kr

### [ 준비위원 ]

분 과 회 장 : 류미이(강원대학교)  
준비위원장 : 한원석(한국전자통신연구원)  
준 비 위 원 : 김중수(영남대학교)  
김진수(전북대학교)  
유재수(경희대학교)  
이창렬(고등광기술연구소)  
허영우(경북대학교)

## 찾아오시는길

### 천안 휴러클 리조트

- **경부고속도로**에서 오는 방법  
천안JC -> 목천IC -> 병천방면 우회전  
-> GS칼텍스 끼고 우회전 -> 천안휴러클리조트 방면
- **중부고속도로**에서 오는 방법  
진천IC좌회전->천안,병천방면으로 직진->천안휴러클리조트 방면
- **네비게이션 안내** "천안휴러클리조트", "데딘워터파크"
- 도로명 주소 : 충남 천안시 동남구 성남면 종합휴양지로 200
- 대표전화 : 042-906-7000

## (주)케이원 솔루션

- **Compound Semiconductor Wafer**  
GaAs / GaN / SiC / InP / Sb / AlN / Silicon / Epi wafer
- **Photo Resist / NIL Resins**  
Negative PR SU-8 Series , Lift off Resists Series  
KMPR 1000 Series, Dry Film
- **Instruments**  
Non-Contact Mobility measurement

### Automatic Optical Inspection for Wafer Defects (Defect Classification and mapping)



## nSPEC

- 1.5마이크론 이하의 Defect 정량 분석
- 모양별 정량/정질 Defect 검수
- Defect Mapping
- Defect 질적 분석 레포트

경기도 광명시 소하동 SK 테크노파크 A동 1313호  
Tel : 82-2-838-2866 Fax : 82-2-838-2867  
<http://www.k1solution.com>  
e\_mail: info@k1solution.com

## 제10회

## 한국진공학회 반도체 및 박막 분과 2012년 동계 Workshop

주제 : 반도체 및 박막을 위한 분석 기술  
**Characterizations of  
semiconductor materials and thin films**



- 일시 : 2012년 11월 22일(목) ~ 23일(금)
- 장소 : 천안 휴러클 리조트(크리스탈홀)
- 주최 : 한국진공학회 반도체 및 박막 분과
- 주관 : 한국진공학회 반도체 및 박막 분과 충남지부  
강원대학교 기초과학연구소
- 후원 : 한국진공학회  
한국전자통신연구원  
(주) 케이원솔루션

## 초대의글

한국진공학회 반도체 및 박막 분과에서는 서울경기, 강원, 충청, 영남, 호남의 5개 권역별로 지부를 운영하면서 각 지부가 중심이 되어 년 2회 정기적으로 하계 및 동계 워크샵을 개최하고 있습니다. 2012년 동계 워크샵은 10회째로 충청남도 천안에서 대학, 연구소 및 산업체의 연구자들과 만남을 통한 연구 교류 및 인적 networking의 자리를 마련하게 되었습니다.

반도체 및 박막 기술은 발전을 거듭하여 최근에는 나노 소재 및 소자기술의 개발이 활발히 진행되고 있습니다. 이러한 새로운 기술의 개발을 가속화하고 산업화를 촉진하기 위해서는 소재 및 구조에 대한 이해, 분석 및 평가가 필수적입니다. 금번 워크샵은 투과전자현미경(TEM), X-선 회절, 광학적 분석, 전기적 측정 등의 다양한 측정 기술을 이용한 반도체 소재 및 소자 분석을 주제로 전문가들을 초청하여 학문적 교류의 장을 마련하였습니다. 회원 여러분의 많은 참여와 관심을 부탁드립니다.

본 워크샵이 개최될 수 있도록 수고를 아끼지 않으신 충청지부와 분과회 위원 여러분께 감사 드립니다. 아울러 바쁘신 중에도 본 워크샵의 초청에 응해주신 연사님들께 다시 한번 깊은 감사의 마음을 전합니다. 회원님들의 건강과 하시는 분야에서 커다란 업적과 진전이 있기를 기원합니다.

한국진공학회 반도체 및 박막분과회장  
류미이

## 프로그램 - 첫째날(11월22일)

## Session-I .....진행 : 김중수(영남대)

- 14:00 ~ 16:30 2013년 동계학술대회 준비회의
- 16:30 ~ 17:00 Coffee Break
- 17:00 ~ 18:00 반도체 및 박막 분과 결산 회의
- 18:00 ~ 20:30 Welcome reception

## 프로그램 - 둘째날(11월23일)

09:30 ~ 10:00 현장 등록

## Opening .....분과회장 류미이(강원대학교)

- 10:00 ~ 10:20 개회사 / 분과회 현황 보고

## Session-II ....좌장 : 한원석(한국전자통신연구원)

- 10:20 ~ 11:05 Advanced TEM technology for semiconductors and materials

박종봉(삼성종합기술원)

- 11:05 ~ 11:50 광분석을 통한 InGaN/GaN LED 활성층의 핵심 물성의 실험적 결정

송정훈(공주대학교)

점심식사( 11:50 ~ 13:20 )

## Session-III .....좌장 : 허영우(경북대학교)

- 13:20 ~ 14:05 박막 특성평가를 위한 X-선 회절 분석

이상걸(한국기초과학지원연구원)

- 14:05 ~ 14:50 Characterizations of advanced materials using electrical measurements

채동훈(한국표준과학연구원)

- 14:50 ~ 15:10 Wafer surface Defect inspection 장비 소개

케이원 솔루션

- 15:10 ~ 15:30 Coffee Break

## Session-IV..좌장 : 이창렬(GIST 고등광기술연구소)

- 15:30 ~ 16:15 Kinetics of semiconductor nanowire nucleation using in situ Transmission Electron Microscopy

김봉중(광주과학기술원)

- 16:15 ~ 17:00 테라헤르츠 펄스를 이용한 반도체의 특성 분석

강철(GIST 고등광기술연구소)

- 17:00 ~ 17:10 폐회사